

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
30. Mai 2002 (30.05.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/43243 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H03H 9/58**

NESSLER, Winfried [AT/DE]; Ulrich von Hutten-
strasse 24, 81739 München (DE). **ELBRECHT, Lüder**
[DE/DE]; Theodor-Dombart-Strasse 1, 80805 München
(DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/12825

(22) Internationales Anmeldedatum:
6. November 2001 (06.11.2001)

(74) **Anwälte: GINZEL, Christian** usw.; Zimmermann &
Partner, Postfach 330 920, 80069 München (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) **Bestimmungsstaaten (national):** JP, KR, US.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR).

(30) **Angaben zur Priorität:**
100 58 339.3 24. November 2000 (24.11.2000) DE

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen

(71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG** [DE/DE]; St.-
Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

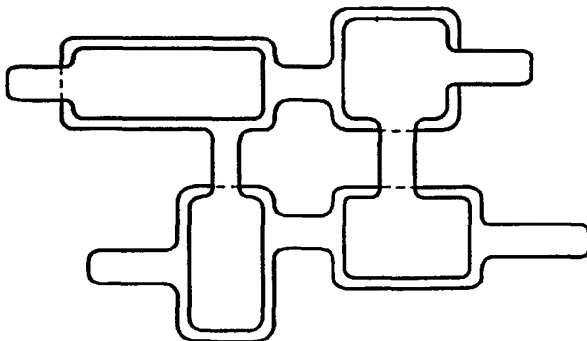
(72) **Erfinder; und**

(75) **Erfinder/Anmelder (nur für US): AIGNER,
Robert** [AT/DE]; Einsteinstr. 104/8-13, 81675
München (DE). **MARKSTEINER, Stephan** [AT/DE];
Cramer-Klett-Strasse 33, 85579 Neubiberg (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) **Title:** BULK ACOUSTIC WAVE FILTER

(54) **Bezeichnung:** BULK-ACOUSTIC-WAVE-FILTER



(57) **Abstract:** The invention relates to bulk acoustic wave
filters comprising at least two bulk acoustic wave resonators,
each of these comprising at least one first electrode, a piezo-
electric layer and a second electrode. At least two of the bulk
acoustic wave resonators have effective resonator surfaces
which differ in their surface form and/or surface content.
The inventive design of the bulk acoustic wave resonators
enables optimal suppression of interference modes without
influencing the impedance level of the filter.

(57) **Zusammenfassung:** Beschrieben werden
Bulk-Acoustic-Wave-Filter mit wenigstens zwei
Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, wobei jeder
Bulk-Acoustic-Wave-Resonator wenigstens eine erste

Elektrode, eine piezoelektrische Schicht und eine zweite Elektrode umfasst. Wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren
weisen effektive Resonatorflächen auf, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden. Durch die beschriebene
Gestaltung der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren lassen sich Störmoden optimal unterdrücken, ohne dass dabei das Impedanzniveau
des Filters beeinflusst wird.



WO 02/43243 A1

Beschreibung

Bulk-Acoustic-Wave-Filter

5

Die Erfindung betrifft Bulk-Acoustic-Wave-Filter.

Elektrische Filter, die aus Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren oder Stacked-Crystal-Filter aufgebaut sind, werden üblicherweise als Bulk-Acoustic-Wave-Filter bezeichnet.

Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren bestehen typischerweise aus zwei Elektroden und einer piezoelektrischen Schicht, die zwischen den beiden Elektroden angeordnet ist. Ein solcher Stapel aus Elektrode 1 / Piezoschicht / Elektrode 2 wird auf einem Träger angeordnet, der die akustische Welle reflektiert (M. Kenneth, G. R. Kline, K. T. McCarron, High-Q Microwave Acoustic Resonators and Filters, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 41, No. 12, 1993).

Die Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen Bulk-Acoustic-Wave-Resonator. Grundsätzlich wäre die Verwendung einer Konfiguration ausschließlich bestehend aus Elektrode 1 / Piezoschicht 3 / Elektrode 2 erstrebenswert. Allerdings weist eine solche Anordnung eine zu geringe Stabilität auf. Daher wird die Anordnung auf ein Substrat 4 aufgebracht, was aber mit dem Nachteil verbunden ist, dass die Schallwellen in das Substrat 4 eindringen und dadurch Störungen verursacht werden. Das Substrat 4 sollte also neben einer mechanischen Trägerfunktion gleichzeitig eine möglichst gute akustische Isolation bereitstellen. Die Figur 1 zeigt einen akustischen Spiegel, der aus einem Substrat 4 und einer Abfolge von zwei low-Z- 5 und zwei high-Z- 6 Schichten besteht.

35

Stacked-Crystal-Filter bestehen im allgemeinen aus zwei piezoelektrischen Schichten und drei Elektroden. Diese

insgesamt fünf Elemente bilden eine Sandwich-Struktur, wobei jeweils eine piezoelektrische Schicht zwischen zwei Elektroden angeordnet ist. Die mittlere der drei Elektroden wird dabei in der Regel als Erdungselektrode verwendet.

5

Die Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch einen Stacked-Crystal-Filter. Der Stacked-Crystal-Filter besteht aus einem Substrat 7, einer Membran 8, einer ersten, unteren Elektrode 9, einer ersten, unteren piezoelektrischen Schicht 10, einer
10 zweiten, oberen piezoelektrischen Schicht 11, einer zweiten mittleren Elektrode 12 und einer dritten, oberen Elektrode 13. Die mittlere Elektrode 12 ist über einem Teil der unteren piezoelektrischen Schicht 10 und der Membran 8 angeordnet, die obere piezoelektrische Schicht 11 ist über Teilen der
15 mittleren Elektrode 12 und der unteren piezoelektrischen Schicht 10 angeordnet und die dritte, obere Elektrode 13 ist über der oberen piezoelektrischen Schicht 11 angeordnet. Die zweite Elektrode 12 dient als Erdungselektrode. Das Substrat 7 weist einen Hohlraum 14 auf, der dazu dient, die
20 akustischen Schwingungen der piezoelektrischen Schichten zu reflektieren.

Die Reflexion der akustischen Schwingungen wird somit entweder mit Hilfe eines akustischen Spiegels oder mit Hilfe
25 eines Hohlraums erreicht. Ein akustischer Spiegel wurde oben im Zusammenhang mit einem Bulk-Acoustic-Wave-Resonator beschrieben, während die Reflexion der akustischen Schwingungen durch einen Hohlraum für einen Stacked-Crystal-Filter gezeigt wurde. Selbstverständlich ist aber auch die
30 umgekehrte Kombination möglich, also ein Bulk-Acoustic-Wave-Resonator mit einem Hohlraum im Substrat genauso wie ein Stacked-Crystal-Filter mit einem akustischen Spiegel.

Die piezoelektrischen Schichten sind in der Regel aus
35 Aluminiumnitrid aufgebaut. Als Material für die Elektroden werden häufig Aluminium, Aluminium-enthaltende Legierungen, Wolfram, Molybdän oder Platin verwendet. Als Substratmaterial

kann z.B. Silizium, Galliumarsenid, Glas oder eine Folie verwendet werden.

Wie oben bereits erläutert weist jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator oder Stacked-Crystal-Filter wenigstens zwei Elektroden auf. Die Figur 3 zeigt eine Aufsicht auf zwei übereinander gelagerte Elektroden, nämlich eine untere Elektrode 15 und eine obere Elektrode 16. Die beiden Elektroden können jede beliebige geometrische Form aufweisen. Als "effektive Resonatorfläche" wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung die Fläche der Elektroden bezeichnet, die sich bei einer Projektion der beiden Elektroden in eine Ebene als der überlappende Bereich der Elektroden ergibt. Die effektive Resonatorfläche der Elektroden 15 und 16 ist in Fig. 3 schraffiert dargestellt. Aufgrund der grundsätzlich beliebigen Form der Elektroden 15 und 16 ergibt sich für die effektive Resonatorfläche eine beliebig geformte ebene Fläche.

Jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator weist somit eine bestimmte effektive Resonatorfläche auf, die durch ihre geometrische Form und durch ihren Flächeninhalt gekennzeichnet ist. Zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren mit unterschiedlicher effektiver Resonatorfläche können sich also grundsätzlich in der Flächenform der effektiven Resonatorfläche und/oder im Flächeninhalt der effektiven Resonatorfläche unterscheiden.

Ein Bulk-Acoustic-Wave-Filter setzt sich aus einer Mehrzahl von parallel bzw. in Reihe geschalteten Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren oder Stacked-Crystal-Filter zusammen. Im folgenden wird der Begriff "Bulk-Acoustic-Wave-Resonator" synonym für die beiden, in den Figuren 1 und 2 gezeigten, Vorrichtungen, nämlich Bulk-Acoustic-Wave-Resonator und Stacked-Crystal-Filter, gebraucht.

Das Design der Bulk-Acoustic-Wave-Filter wird in der Regel derart gestaltet, dass die in Serie geschalteten Resonatoren eine serielle Resonanz aufweisen, deren Frequenz möglichst genau der gewünschten Frequenz des Filters entspricht, während entsprechend die parallel geschalteten Resonatoren eine parallele Resonanz aufweisen, deren Frequenz ebenfalls möglichst genau der gewünschten Frequenz des Filters entspricht.

Eine besondere Problematik bei der Verwendung von Bulk-Acoustic-Wave-Filtern stellen die Störmoden der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, aus denen die Filter aufgebaut sind, dar. Diese Störmoden führen zu Störspitzen in der elektrischen Impedanzkurve der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, die sich in weiterer Folge auch auf den Durchlassbereich der Filter nachteilig auswirkt. Vor allem wird das Stehwellenverhältnis verschlechtert bzw. die Phasenkurve der Filter verzerrt, wodurch z.B. in Receiver-Frontends die Bedingung konstanter Gruppenlaufzeit innerhalb eines Sendekanals verletzt wird.

Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Ansätze bekannt, mit denen eine Unterdrückung der Störmoden versucht wird. Die US 5,903,087 offenbart Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, deren Elektroden an den Rändern nicht geglättet sind, sondern vielmehr in Form eines Zufallsmusters angerauhte Ränder aufweisen, wobei die Rauigkeit ungefähr die Dimension der Wellenlängen der Störmoden aufweist. Die Störmoden werden dadurch unterdrückt und sind in der Impedanzkurve weniger sichtbar. Allerdings treten bei diesem Verfahren starke Energieverluste auf, die sich auf die Güte der Hauptresonanzen auswirken.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, Bulk-Acoustic-Wave-Filter zur Verfügung zu stellen, bei denen die Störmoden gedämpft werden, aber gleichzeitig

die Nutzresonanz nur unwesentlich oder überhaupt nicht beeinflusst wird.

Diese Aufgabe wird durch den Bulk-Acoustic-Wave-Filter gemäß unabhängigem Patentanspruch 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen, Ausgestaltungen und Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen, der Beschreibung und den beiliegenden Zeichnungen.

10

Der erfindungsgemäße Bulk-Acoustic-Wave-Filter umfasst wenigstens zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, wobei jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator wenigstens eine erste Elektrode, eine piezoelektrische Schicht und eine zweite Elektrode umfasst. Wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren weisen effektive Resonatorflächen auf, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden. Durch diese Gestaltung der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren lassen sich Störmoden optimal unterdrücken, ohne dass dabei das Impedanzniveau des Filter beeinflusst wird.

20

Da jeder Resonator andere Störmodenfrequenzen aufweist, kommt es durch die Verschaltung im Filter zu einem Mittelungseffekt. Dadurch macht sich die einzelne Störmode im Filterresponse im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten Bulk-Acoustic-Wave-Filtern mit Resonatoren gleicher Fläche nicht so stark bemerkbar. Allerdings beeinflussen unterschiedliche Flächeninhalte der effektiven Resonatorflächen auch das Impedanzniveau der Resonatoren. Sie sind daher durch Impedanzanpassbedingungen im Filter in einem gewissen Rahmen festgelegt.

30

Sämtliche Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung beruhen also darauf, dass nicht versucht wird, den einzelnen Bulk-Acoustic-Wave-Resonator störmodenfrei zu machen, was technisch schwierig ist und möglicherweise Resonator-Perfomance kostet, sondern darauf, dass erst mit der

35

Verschaltung im Filter eine Verwaschung von vielen Störmoden bei unterschiedlichen Frequenzen eintritt und damit die Transmissionsfunktion des Filters den erwünschten glatten Verlauf erhält.

5

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren des Bulk-Acoustic-Wave-Filters effektive Resonatorflächen auf, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden.
10 Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eine effektive Resonatorfläche mit
15 unterschiedlichem Aspektverhältnis auf. Das Aspektverhältnis beeinflusst die Lage der Störmoden in ähnlicher Weise wie sie durch den Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren beeinflusst wird, verändert aber das Impedanzniveau nicht. Die Störmoden werden somit
20 wirkungsvoll unterdrückt, wobei gleichzeitig die Nutzresonanz unverändert bleibt.

Besonders bevorzugt wird eine Ausführungsform, bei der alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive
25 Resonatorflächen mit unterschiedlichen Aspekt-Verhältnissen aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Ebenfalls bevorzugt wird eine Ausführungsform der
30 vorliegenden Erfindung gemäß der wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit einer nicht-rechtwinkligen Form aufweisen. Unter einer nicht-rechtwinkligen Form der effektiven Resonatorfläche eines Bulk-Acoustic-Wave-Resonators wird eine Form verstanden, bei
35 der die Winkel zwischen den Begrenzungslinien der effektiven Resonatorfläche ungleich 90° sind. Durch diese Ausgestaltung

der Resonatoren gelingt eine gute Unterdrückung der Störmoden.

5 Besonders bevorzugt wird eine Ausführungsform, bei der alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit einer nicht-rechtwinkligen Form aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

10 Beste Resultate lassen sich mit Bulk-Acoustic-Wave-Filtern erzielen, bei denen wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichem Flächeninhalt und gleichzeitig unterschiedlichem Aspektverhältnis aufweisen. Durch passende
15 Wahl des Flächeninhalts der effektiven Resonatorfläche und gleichzeitige Variation des Aspektverhältnisses der effektiven Resonatorfläche lassen sich sowohl Impedanzanpassungsbedingungen erfüllen als auch Störmoden optimal unterdrücken.

20 Eine weitere Verbesserung wird mit Ausführungsformen erzielt, bei denen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Flächeninhalten und unterschiedlichen Aspektverhältnissen
25 aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

 Ebenfalls bevorzugt werden Bulk-Acoustic-Wave-Filter, wobei wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eine
30 effektive Resonatorfläche mit unterschiedlichem Aspektverhältnis und gleichzeitig nicht-rechtwinkliger Form aufweisen.

 Besonders bevorzugt werden Ausführungsformen, bei denen
35 alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen

und nicht-rechtwinkliger Form aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Besonders bevorzugt werden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, gemäß denen wenigstens zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eines Bulk-Acoustic-Wave-Filters eine effektive Resonatorfläche mit unterschiedlichem Flächeninhalt, unterschiedlichen Aspektverhältnis und nicht-rechtwinkliger Form aufweisen.

10

Ebenfalls besonders bevorzugt werden Ausführungsformen, bei denen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Flächeninhalten, unterschiedlichen Aspektverhältnissen und nicht-rechtwinkliger Form aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

15

Besonders gute Störmodenunterdrückung wird erreicht, wenn das Aspektverhältnis der effektiven Resonatorflächen der erfindungsgemäßen Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren zwischen 1:1 und 1:5 liegt, insbesondere zwischen 1:1.5 und 1:3.

20

Weisen die effektiven Resonatorflächen der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren unterschiedlichen Flächeninhalt auf, so wird bevorzugt, dass sich der Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen um wenigstens 5 % voneinander unterscheidet, insbesondere um wenigstens 10 %. Ganz besonders bevorzugt wird, dass sich der Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen um wenigstens 20 % voneinander unterscheidet, insbesondere um wenigstens 50 %.

30

Die Bulk-Acoustic-Wave-Filter werden durch Verschaltung von Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren hergestellt. Das Prinzip, den Flächeninhalt der effektiven Resonatorfläche, das Aspektverhältnis der effektiven Resonatorfläche und/oder den Winkel zwischen den Begrenzungslinien der effektiven Resonatorflächen zu variieren, um Störmoden im Filterresponse

35

zu unterdrücken, lässt sich auf jede Filtertopologie anwenden. Gemäß besonders bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung erfolgt die Verschaltung in Form eines 1½-stufigen Leiterfilters, in Form eines 2-stufigen
5 Leiterfilters, in Form eines 2½-stufigen Leiterfilters, in Form eines 3-stufigen Leiterfilters oder in Form eines 3½-stufigen Leiterfilters, wobei 3, 4, 5, 6 oder 7 Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren verschaltet werden.

10 Ebenfalls bevorzugt wird die Verschaltung der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren zu einem Bulk-Acoustic-Wave-Filter in Form eines 1-stufigen balanced Filters, in Form eines 2-stufigen balanced Filters oder in Form eines 3-stufigen balanced Filters. Es werden in diesem Fall 4, 8 oder 12 Bulk-
15 Acoustic-Wave-Resonatoren verschaltet.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 8 näher dargestellt. Es zeigen:

- 20 Fig. 1 einen aus dem Stand der Technik bekannten Bulk-Acoustic-Wave-Resonator;
- Fig. 2 einen aus dem Stand der Technik bekannten Stacked-Crystal-Filter;
- 25 Fig. 3 zwei übereinandergelagerte Elektroden und deren effektive Resonatorfläche;
- Fig. 4 einen aus dem Stand der Technik bekannten 2-
30 stufigen Leiterfilter;
- Fig. 5 einen erfindungsgemäßen 2-stufigen Leiterfilter aufgebaut aus Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren mit unterschiedlichem
35 Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen;

10

- Fig. 6 einen erfindungsgemäßen 2-stufigen
Leiterfilter aufgebaut aus Bulk-Acoustic-
Wave-Resonatoren mit unterschiedlichem
Aspektverhältnis der effektiven
5 Resonatorflächen;
- Fig. 7 Auftragung (schematisch) des Streuparameters
von Eingang zu Ausgang (S_{12}) gegen die
Frequenz für einen 3-stufigen Leiterfilter
10 mit 6 identischen quadratischen
Einzelresonatoren (Stand der Technik);
- Fig. 8 Auftragung (schematisch) des Streuparameters
von Eingang zu Ausgang (S_{12}) gegen die
15 Frequenz für einen 3-stufigen Leiterfilter
mit 6 Einzelresonatoren mit unterschiedlichen
Aspektverhältnissen der effektiven
Resonatorflächen (Erfindung).
- 20 Fig. 4 zeigt einen aus dem Stand der Technik bekannten
2-stufigen Leiterfilter mit 4 gleich großen quadratischen
Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, die eine identische effektive
Resonatorfläche aufweisen. Die Störmoden jedes
Einzelresonators treten an den gleichen Frequenzstellen auf
25 und sind entsprechend im elektrischen Response des Filters zu
finden.
- Fig. 5 zeigt einen 2-stufigen Leiterfilter mit 4 Bulk-
Acoustic-Wave-Resonatoren mit effektiven Resonatorflächen,
30 die unterschiedliche Flächeninhalte aufweisen. Jeder
Resonator hat unterschiedliche Störmodenfrequenzen. Durch die
Verschaltung im Filter kommt es zu einem Mittelungseffekt,
wodurch sich die einzelne Störmode im Filterresponse im
Vergleich zu der in Fig. 4 gezeigten Ausführungform des
35 Standes der Technik nicht so stark bemerkbar macht.

Fig. 6 zeigt einen 2-stufigen Leiterfilter mit 4 Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren mit effektiven Resonatorflächen, die zwar gleichen Flächeninhalt, aber unterschiedliche Aspektverhältnisse aufweisen. Das Aspektverhältnis beeinflusst die Lage der Störmoden in ähnlicher Weise wie bei der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform, wobei aber gleichzeitig das Impedanzniveau des Filters unverändert bleibt.

Die Figuren 7 und 8 zeigen jeweils eine schematische Auftragung des Streuparameters von Eingang zu Ausgang S_{12} in logarithmischer Skala gegen die Frequenz für einen 3-stufigen Leiterfilter mit 6 Einzelresonatoren. Zur Bestimmung von S_{12} wurde in bekannter Weise durch einen Frequenzanalysator die Streumatrix des Leiterfilters ermittelt.

In der Fig. 7 ist die Kennlinie eines aus dem Stand der Technik bekannten Leiterfilters, der aus 6 gleichen quadratischen Einzelresonatoren mit identischen effektiven Resonatorflächen besteht, dargestellt. Die Kennlinie zeigt ein "Rauschen" im Passband, das von spurious modes der Einzelresonatoren verursacht ist.

In der Fig. 8 ist die Kennlinie eines Leiterfilters gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt, der die gleiche Topologie aufweist wie der Leiterfilter, dessen Kennlinie in Fig. 7 dargestellt ist, allerdings weisen die effektiven Resonatorflächen der 6 Einzelresonatoren unterschiedliche Aspektverhältnisse auf. Das Rauschen im Passband mittelt sich aus der Kurve heraus, da die spurious modes der Einzelresonatoren an verschiedenen Frequenzpunkten auftreten.

Ähnliche Ergebnisse liefert ein Vergleich von einerseits Filtern mit Einzelresonatoren mit quadratischen effektiven Resonatorflächen und andererseits Filtern, bei denen die effektiven Resonatorflächen der Einzelresonatoren nicht rechtwinklige Form aufweisen (Winkel zwischen den

Begrenzungslinien der effektiven Resonatorflächen der Einzelresonatoren ungleich 90°). Hier wird ein deutlich geringeres Rauschen im Passband für den Filter festgestellt, dessen Einzelresonatoren effektive Resonatorflächen mit

5 nicht-rechtwinkliger Form aufweisen.

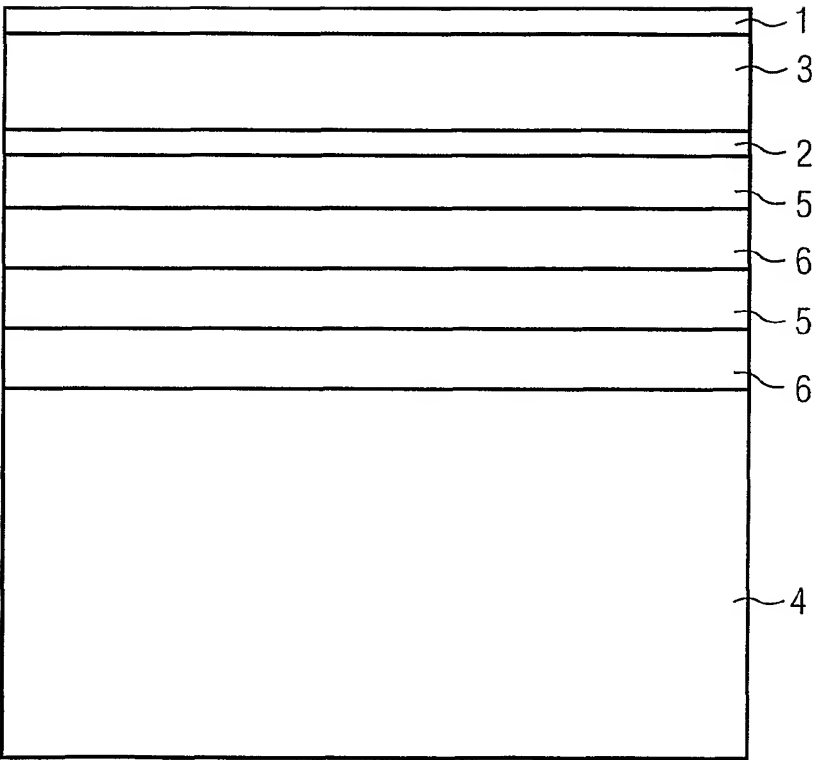
Patentansprüche

1. Bulk-Acoustic-Wave-Filter umfassend wenigstens zwei Bulk-
5 Acoustic-Wave-Resonatoren, wobei jeder Bulk-Acoustic-Wave-
Resonator wenigstens eine erste Elektrode, eine
piezoelektrische Schicht und eine zweite Elektrode
umfasst,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s
10 wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren
effektive Resonatorflächen aufweisen, die sich in
Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden.
2. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 1,
15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s
alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive
Resonatorflächen aufweisen, die sich in Flächenform
und/oder Flächeninhalt unterscheiden.
- 20 3. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s
die effektiven Resonatorflächen von wenigstens zwei der
Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren ein unterschiedliches
Aspektverhältnis aufweisen.
25
4. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s
die effektiven Resonatorflächen aller Bulk-Acoustic-Wave-
Resonatoren unterschiedliche Aspektverhältnisse aufweisen.
30
5. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s
die effektiven Resonatorflächen von wenigstens zwei der
35 Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eine nicht-rechtwinklige
Form aufweisen.

6. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die effektiven Resonatorflächen aller Bulk-Acoustic-Wave-
Resonatoren eine nicht-rechtwinklige Form aufweisen.
- 5 7. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der Ansprüche 3 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Aspekt-Verhältnis der effektiven Resonatorflächen
10 zwischen 1:1 und 1:5 liegt.
8. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Aspekt-Verhältnis der effektiven Resonatorflächen
15 zwischen 1:1.5 und 1:3 liegt.
9. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
20 sich der Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen um
wenigstens 5 % voneinander unterscheidet, insbesondere um
wenigstens 10 %.
10. Bulk-Acoustic-Wave-Filter Anspruch 9,
25 dadurch gekennzeichnet, dass
sich der Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen um
wenigstens 20 % voneinander unterscheidet, insbesondere um
wenigstens 50 %.
- 30 11. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren in Form eines 1½-
stufigen Leiterfilters, in Form eines 2-stufigen
35 Leiterfilters, in Form eines 2½-stufigen Leiterfilters, in
Form eines 3-stufigen Leiterfilters oder in Form eines 3½-
stufigen Leiterfilters verschaltet sind.

12. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der Ansprüche 1 bis
10,
dadurch gekennzeichnet, dass
5 die Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren in Form eines 1-
stufigen balanced Filters, in Form eines 2-stufigen
balanced Filters oder in Form eines 3-stufigen balanced
Filters verschaltet sind.

FIG 1



2/4

FIG 2

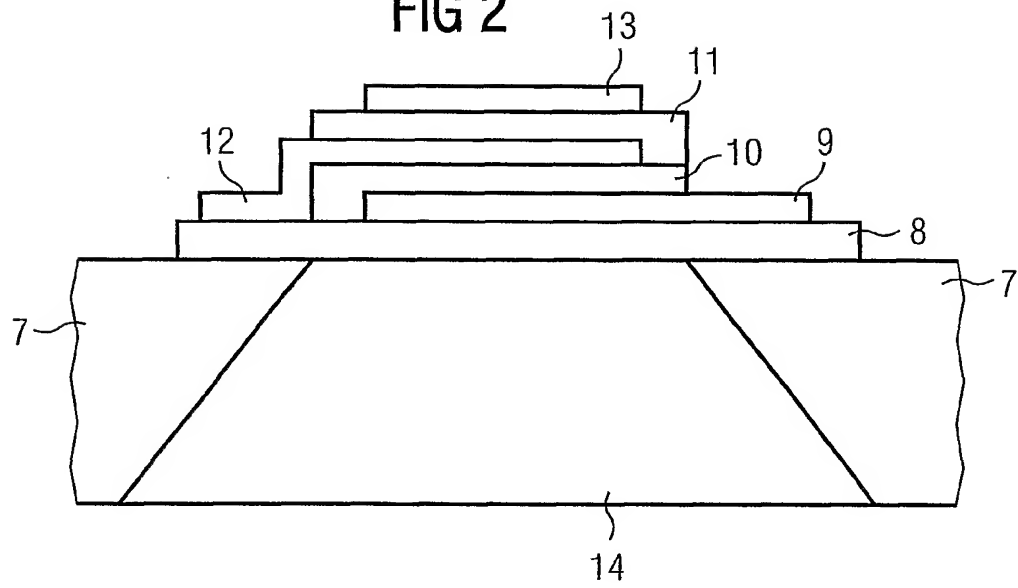
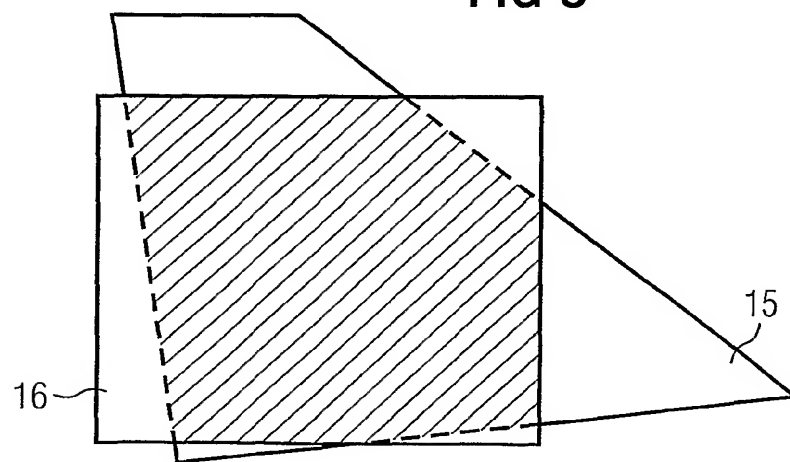


FIG 3



3/4

FIG 4

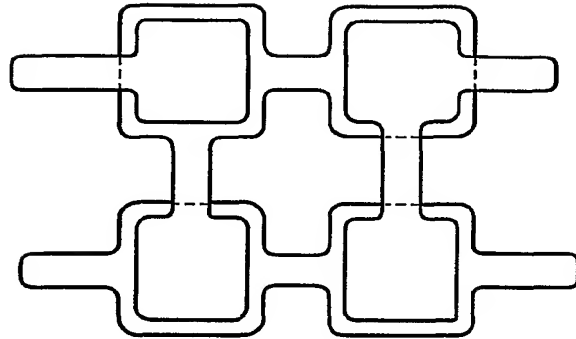


FIG 5

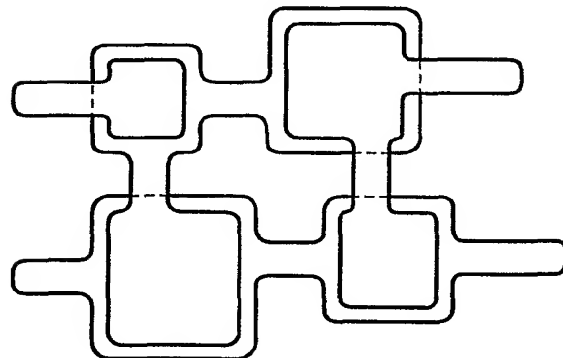
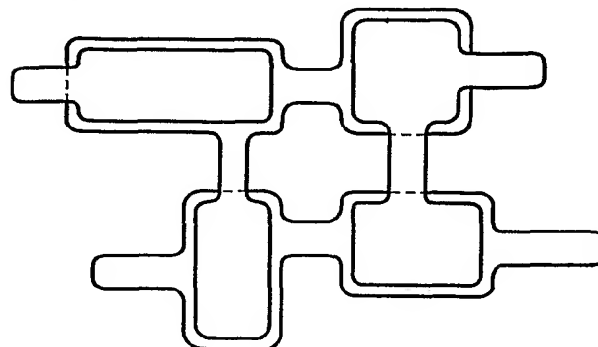


FIG 6



4/4

FIG 7

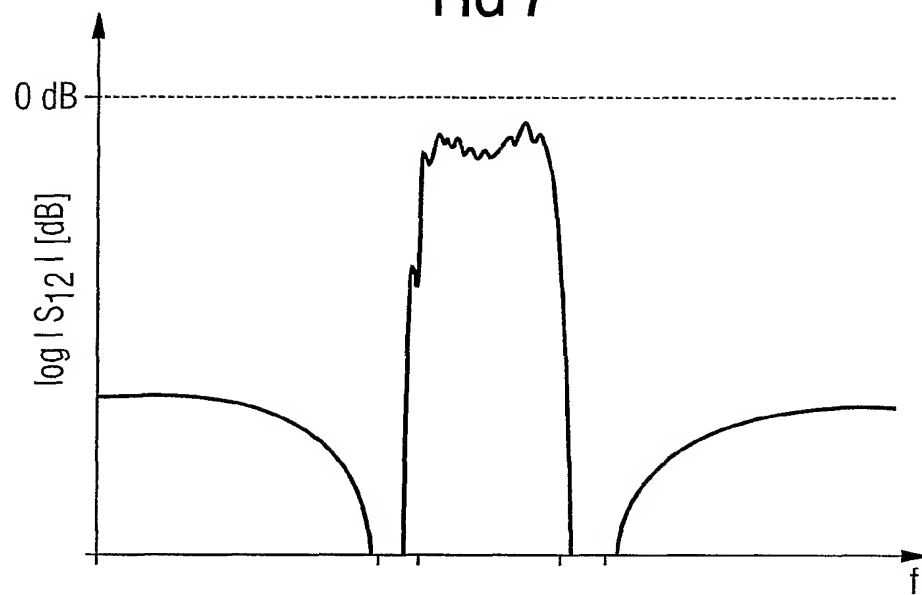
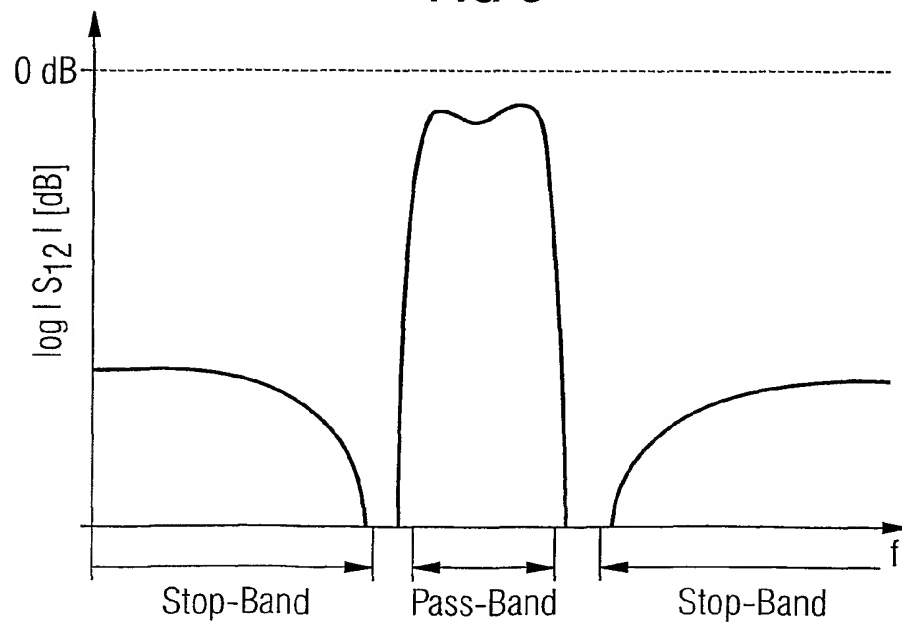


FIG 8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 01/12825A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H03H9/58

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H03H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 572 173 A (OGAWA TATSUO ET AL) 5 November 1996 (1996-11-05)	1-3,7,8
A	column 4, line 59 -column 5, line 28; figures 4-6	4,9,10
A	----- US 4 317 093 A (LUNGO ANTONIO) 23 February 1982 (1982-02-23) column 2, line 35,36 claim 35 -----	4,5

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 April 2002

Date of mailing of the international search report

19/04/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Coppieters, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 01/12825

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5572173	A	05-11-1996	JP	7226651 A	22-08-1995
			JP	7226652 A	22-08-1995
US 4317093	A	23-02-1982	CA	1153077 A1	30-08-1983
			JP	55137712 A	27-10-1980

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tionales Aktenzeichen
PCT/EP 01/12825

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H03H9/58

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H03H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 572 173 A (OGAWA TATSUO ET AL) 5. November 1996 (1996-11-05)	1-3, 7, 8
A	Spalte 4, Zeile 59 - Spalte 5, Zeile 28; Abbildungen 4-6	4, 9, 10
A	US 4 317 093 A (LUNGO ANTONIO) 23. Februar 1982 (1982-02-23) Spalte 2, Zeile 35, 36 Anspruch 35	4, 5

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

* & * Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10. April 2002

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

19/04/2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Coppieters, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

I onales Aktenzeichen
PCT/EP 01/12825

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5572173 A	05-11-1996	JP 7226651 A JP 7226652 A	22-08-1995 22-08-1995
US 4317093 A	23-02-1982	CA , 1153077 A1 JP 55137712 A	30-08-1983 27-10-1980